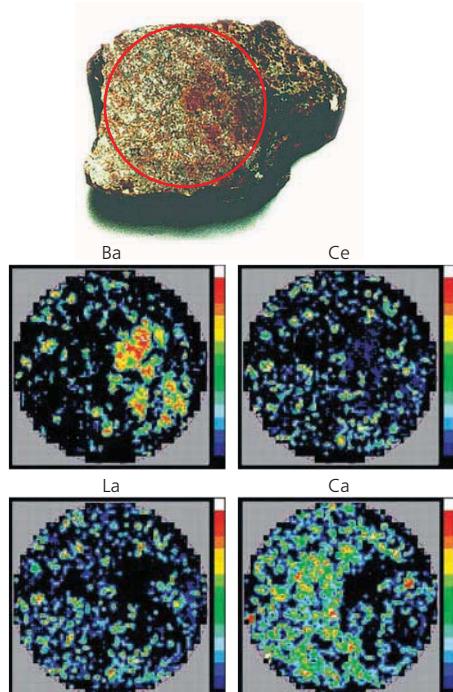


- Для качественного и количественного элементного анализа. Для картирования элементов.

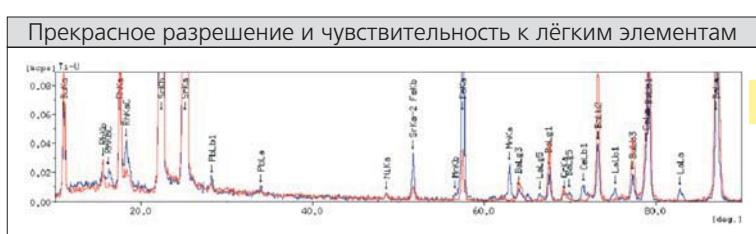
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ СПЕКТРОМЕТР **LAB CENTER XRF-1800**



Прекрасная чувствительность к лёгким элементам и великолепное разрешение линий редкоземельных металлов.
Идеальное средство для анализа неоднородных объектов.



Образец представляет собой руду редкоземельных металлов Бастназит. Красным кругом отмечен анализируемый участок диаметром 30 мм с картированием. La и Ce имеют одинаковую концентрацию, а Ba и Ca распределены по образцу неравномерно; это означает, что образец содержит по крайней мере три разных минерала.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Качественный и количественный анализ в диапазоне от Be до U за 2,5 минуты
- Картирование распределения элементов с шагом 250 мкм
- Локальный анализ в точке Ø 500 мкм с помощью микроколлиматоров и встроенной цифровой камеры
- Качественный и количественный анализ с применением линий высших порядков (патент)
- Определение толщины и элементного состава плёнок органической природы методом фундаментальных параметров с использованием линий Комptonовского рассеяния (патент), определение толщины и элементного состава неорганических покрытий
- Уникальная система пробоподачи образца

Результаты количественного анализа		
Компонент	Содержание (%)	
	Участок 1	Участок 2
SiO ₂	1,526	24,648
Al ₂ O ₃	0,451	0,215
Fe ₂ O ₃	0,797	2,540
MnO	—	0,461
MgO	0,653	6,369
CaO	0,456	29,079
Na ₂ O	0,672	—
K ₂ O	0,125	0,066
P ₂ O ₅	—	0,626
SO ₃	40,242	10,237
BaO	36,417	14,712
SrO	18,257	7,194
La ₂ O ₃	—	0,947
CeO ₂	—	2,615

Технические характеристики

Диапазон определяемых элементов От бериллия по уран, базовая комплектация от кислорода по уран

Рентгеновский генератор

Трубка Rh-анод с тонким торцевым окном, мощность 4 кВт

Параметры 60 кВ, 140 мА

Система охлаждения Двойной контур, внутренний замкнутый для охлаждения анода, внешний открытый/замкнутый. Рециркулятор воды (опция)

Спектрометр

Облучение образца Сверху; образец вращается со скоростью 60 об/мин

Система ввода образца Маятникового типа, без динамических нагрузок

Автосамплер 8 позиций, 40-позиционный (опция)

Держатели образцов 7 для массивных образцов, один для локального анализа

Размер образца 51 мм в диаметре, высота 38 мм

Первичные фильтры Автоматическая смена Al/Ti/Ni/Zr/без фильтра

Апертуры Автоматическая смена 5 типов: 500 мкм; 3, 10, 20, 30 мм

Локальный анализ 0,5 мм диаметр, цифровая камера для контроля области анализа (опция)

Первичные щели Автоматическая смена 3-х типов: стандартная, с высоким разрешением, с высокой чувствительностью

Аттенюатор Автоматическое включение/выключение

Сменщик кристаллов Автоматическая смена 10 кристаллов в двух направлениях

Кристаллы-анализаторы LiF (200), PET, Ge, TAP стандартные;

LiF (220), SX-52, SX-1, SX-14, SX-88, SX-98, SX-76, SX-410 опции

Детекторы Сцинтилляционный счётчик (SC) для тяжёлых элементов, проточный пропорциональный счётчик (FPC) для лёгких элементов

Система подачи газа для FPC Электронный контроль плотности; потребление газа 5 см³/мин

Контроль степени разрежения Стабилизатор вакуума

Атмосфера анализа Воздух/вакуум и рование; предварительное вакуумирование с двумя скоростями; система напуска гелия/азота (опция)

Программное обеспечение

Локальный анализ Количественный анализ в точке, картирование с шагом 250 мкм, распределение по интенсивностям/концентрациям

Количественный анализ Метод фундаментальных параметров (ФП)

Метод фоновых ФП для расчёта толщины и состава плёнок

Метод калибровочных кривых

Матричная коррекция (5 методов)

Расчет коэффициентов матричной коррекции методом SFP

Измерение интенсивностей пиков и интегральных интенсивностей

Программа сопоставления состава по библиотекам пользователя

Качественный анализ Измерение линий высших порядков

Автоматический контроль чувствительности

Сглаживание, коррекция фона, поиск пиков и их автоматическая идентификация, разделение пиков, расчёт фона по 16 точкам

Редактирование пиков (добавление/вычитание, маркировка, листинг вероятных элементов для неизвестных пиков), наложение до 8 спектров, изменение шкалы измерений (угол 2θ, длина волны, энергия, линейный и логарифмический масштабы интенсивности излучения)

Отчётность

Дневной доклад, месячный доклад, статистическая обработка, передача данных по сети

Обслуживание

Непрерывный мониторинг системы